

第18回日本加速器学会年会 2021/08/11 **井藤 隼人**1, 荒木 隼人1, 髙橋 光太郎2, 梅森 健成 1, 2





- ¹KEK
- ² SOKENDAI

Outline

- ファーナスベーキング法について
- 空洞性能測定結果
 - Q-E カーブ
 - BCS 抵抗 (R_{BCS})
 - 残留抵抗 (Rres)
 - トラップ磁場に対する表面抵抗の感度
 - ・昇温中の周波数変化
- ・まとめ









ファーナスベーキング法









ファーナスベーキング法を用いることで、 よりシンプルな手法で高Q値を実現する。





KEKでのファーナスベーキング

- 内表面をリフレッシュ 200-800°C, 3 h









Light EP — HPR — Furnace baking — HPR — Cleanroom assembly — RF test • ベーキングなし 内表面が大気や水にさられる



 内表面をリフレッシュ • 200-800°C, 3 h



Hayato Ito, PASJ2021 WEOA05



空洞性能測定のセットアップ



Hayato Ito, PASJ2021 WEOA05





- 磁気シールドやソレノイドコイルを 用いて環境磁場を~1mG以下に抑 える
- 温度勾配をつけながら冷却すること で磁束トラップを抑える
- 以下のパラメータでファーナスベー キングを行った単セル空洞の性能測 定を行った
 - •200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800°C, 3 h











Q-E カーブの比較



Hayato Ito, PASJ2021 WEOA05





Cavity temperature during measurement

- 120 ~ 600°C baking ... at 2.0 K (2.00~2.01 K)
- 800°C baking ... at 2.1 K (2.07K)

250 ~ 400°C 3 h

- 非常に高いQ値とanti-Q slope
- 300℃ファーナスベーキング空洞の最高Q値は~5E10 at 2.0 K

標準処理 (120°C 48 h), 200°C 3 h

- 200℃ファーナスベーキング空洞は標準処理空洞とほぼ 同等の性能
- 低 E_{acc} 側での Q-E の振る舞いが異なる 500 ~ 800°C 3 h
- Q値は標準処理空洞と同程度
- High field Q slope が発生した

• ベーキング温度の違いで Q-E の挙動は大きく変化する

• 300~400℃のファーナスベーキングでは、最大 Eacc は 25 MV/m 程度となっている



















ベーキング温度の違いで R_{BCS} の振る舞いが 大きく変化する。

標準処理 (120°C 48 h), 200°C 3 h

- E_{acc}の増加とともに R_{BCS}も増加する
- R_{BCS}の傾きは急激

500 ~ 800°C 3 h

標準処理に比べて R_{BCS}の傾きは緩やか

250 ~ 400°C 3 h

- Eaccの増加とともに RBCS は減少する
- 2つの 300℃ ベーキング空洞の R_{BCS}の再現性は良い











Hayato Ito, PASJ2021 WEOA05







R_{res}の比較







- ファーナスベーキングと標準処理で R_{res}の振る舞い
 に差がある
- ベーキング温度の違いで R_{res}の振る舞いが変化する
 が、R_{BCS} ほどの変化はない

標準処理 (120°C 48 h)

- 高い R_{res}
- R_{res}は10 MV/m で最小値をとる

ファーナスベーキング (200~800°C 3 h)

- 標準処理よりも低い Rres
- 600°C ベーキングでの R_{res} は極めて低い (~0.2 nΩ)





R_{BCS}, R_{res} とベーキング温度の関係



- Eacc が高くなるほど違いがはっきりする
- R_{BCS}の極小値は 300℃ 付近、R_{res}の極小値は 600℃ 付近に存在する











トラップ磁場に対する表面抵抗の感度











昇温中の周波数変化









200°C ベーキングでのベーキング時間の影響











空洞依存性や予冷の効果 今後、 について調査する予定。





まとめ

- 単セル空洞に対して様々な温度でファーナスベーキングを行った
- ベーキング温度の違いで空洞性能が大きく変化することを明らかにした
- 特に 300℃ ファーナスベーキング空洞は極めて高いQ値を示すことが分かった
 - -> ファーナスベーキングは窒素ドープよりもシンプルなプロセスで高 Q 値空洞を実現する ことができる
- 今後も更に調査を進めていく予定である:
 - 表面状態を明らかにするためのサンプルを用いた調査
 - 9セル空洞、large grain 空洞への応用
 - ベーキングパラメータの最適化
 - → 高 Q 値と高 E_{acc} を両立





15